

СПИН-ЗАВИСИМАЯ ПРОВОДИМОСТЬ ПО ДИСЛОКАЦИЯМ В Si

B.V.Кведер, Ю.А.Осипьян, А.И.Шалынин

В пластически деформированном кремнии при $T = 1,4\text{ К}$ обнаружено резонансное изменение дислокационной проводимости. Предполагается, что эффект связан с взаимодействием носителей тока с локализованными на дислокациях парамагнитными *Сh*-центрами, неизвестными ранее.

В настоящее время можно считать твердо установленным, что при пластической деформации в кристаллах кремния появляются парамагнитные центры, представляющие собой цепочки оборванных связей в ядрах дислокаций (ДОС), а также различные дефекты на дислокациях. Эти центры дают специфический сигнал электронного парамагнитного резонанса (ДЭПР) ^{1, 2}. Наряду с ДЭПР, в пластически деформированном кремнии наблюдается значительная высокочастотная электропроводность вдоль дислокационных линий, связанная с движением захваченных дислокациями электронов (*n*-тип) и дырок (*p*-тип) ³. В этой связи представляло бы значительный интерес исследование влияния спинового состояния дислокационных парамагнитных центров на проводимость вдоль дислокаций. Однако в неотожженных кристаллах, где электроны и дырки в основном захватываются непосредственно на ДОС, нам такой эффект наблюдать пока не удалось. В настоящей работе мы сообщаем об обнаружении спин-зависимой проводимости в образцах, отожженных после деформации при $800 \div 850^\circ\text{C}$.

Как следует из приведенных ранее наблюдений ² отжиг пластически деформированных образцов при $T > 700^\circ\text{C}$ приводит к ослаблению вплоть до полного исчезновения сигнала ЭПР цепочек ДОС. Мы объясняем это реконструкцией атомного строения ядер дислокаций, приводящей к замыканию ДОС. Глубокие электронные состояния, связанные с наличием непосредственно ДОС при этом исчезают. Однако в этом случае могут сохраняться некоторые одномерные зоны, обусловленные сильным искажением решетки кристалла вокруг дислокаций. Носители, захваченные в эти состояния могут также давать проводимость вдоль дислокаций и обладая спином должны чувствовать спиновое состояние находящихся в ядрах дислокаций парамагнитных дефектов. Можно полагать, что именно это явление наблюдалось в наших экспериментах.

Исследовались образцы кремния *n*-типа ($2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$ и $10^{15} \text{ см}^{-3} P$) и *p*-типа ($10^{13} \text{ см}^{-3} B$) пластиически деформированные на $2 \div 3\%$ сжатием вдоль [110] при 680°C . Затем образцы отжигались 30 минут при $800 \div 850^\circ\text{C}$.

Измерения проводились при $T = 1,4\text{K}$. Образец помещался в прямоугольный резонатор (H_{102}) супергетеродинного ЭПР спектрометра с рабочей частотой $f_0 \approx 9,5 \text{ ГГц}$. В тот же резонатор подводилась СВЧ мощность (накачка) на частоте $f_{\text{H}} \approx 18 \text{ ГГц}$. Приемная часть ЭПР спектрометра была защищена от попадания в нее сигнала накачки при помощи отражательного фильтра. Резонатор был тщательно заэкранирован от ИК излучения теплых частей волновода и криостата. Имелась возможность освещать образец миниатюрной лампочкой накаливания. На статическое магнитное поле H накладывалась модуляция с амплитудой $0,3 \text{ Э}$, частотой 80 Гц , что позволяло регистрировать производные поглощения и дисперсии.

На рис. 1 (кривая 3) представлена производная поглощения высокочастотной мощности на частоте f_0 в присутствии 18 ГГц накачки при сканировании H вблизи $H_{\text{H}}^{\text{рез}} \approx 6 \text{ кЭ}$. В отсутствии накачки сигнал не наблюдается. Установлено, что регистрируемый сигнал (назовем его *Ch*-линией) не связан с просачиванием мощности накачки в приемный тракт или нагревом образца. *Ch*-линия появляется только после освещения образца лампочкой и амплитуда практически не меняется в течение нескольких часов после выключения света. Сигнал наблюдается только в образцах с дислокациями.

Обнаруженный сигнал наблюдается также в полях $H_0^{\text{рез}} \approx 3 \text{ кЭ}$ вне зависимости от наличия 18 ГГц накачки. Сигнал резко уменьшается при смещении образца в область высокочастотного магнитного поля резонатора, где электрическое поле на рабочей частоте f_0 мало.

На рис. 1 приведены производные поглощения (1) и дисперсии (2) в поле $\approx 3 \text{ кЭ}$. Величины *g*-фактора $H_{\text{H}}^{\text{рез}} / \gamma f_{\text{H}}$ и $H_0^{\text{рез}} / \gamma f_0$ совпадают. Справа показана линия ЭПР эталона Mn^{++} в MgO .

На рис. 2 показана анизотропия положения *Ch*-линии для трех различных направлений вращения кристалла (ось вращения $\vec{\Omega}$ была перпендикулярна H). Сплошными кривыми проведены расчетные зависимости, соответствующие *g*-тензору с $g_{11} = 1,9915 \pm 5 \cdot 10^{-4}$, $g_{22} = 2,0064 \pm 5 \cdot 10^{-4}$, $g_{33} = 2,0159 \pm 5 \cdot 10^{-4}$, главные оси которого имеют в системе координат кристалла [100], [010], [001] направляющие косинусы $\eta_1 \approx (0,38; -0,9; -0,2)$, $\eta_2 \approx (0,32; -0,06; 0,94)$, $\eta_3 \approx (0,87; 0,43; -0,25)$. Было установлено, что амплитуда линии *Ch* сильно изменяется при вращении кристалла, и линия практически исчезает при $E_{f_0} \perp [110]$, где E_{f_0} – высокочастотное электрическое поле. (Заметим, что $E_{f_0} \parallel H$). На рис. 3 для примера показана относительная амплитуда линии при вращении кристалла вокруг оси [110], сплошная кривая соответствует $A/A_{\max} = 0,83 \cos^2 \varphi + 0,1$. Кривая проведена методом наименьших квадратов. Здесь φ – угол между направлением [110] и $E_{f_0} \parallel H$. Ширина линии при этом практически не меняется.

Представленные результаты на наш взгляд свидетельствуют о том, что наблюдаемая *Ch*-линия связана с резонансным изменением одномерной или квазиодномерной проводимости некоторых объектов, лежащих вдоль направления [110]. При $1,4\text{K}$ в отсутствии подсветки такие объекты могут обладать проводимостью лишь в том случае, если с ними связаны электронные энергетические зоны, лежащие в запрещенной зоне кремния.

По-видимому, обнаруженный эффект связан с взаимодействием движущихся по таким квазиодномерным объектам носителей тока с некоторыми параметрическими центрами (*Ch*-центрами), локализованными на, или в непосредственной близости от этих объектов. На наш взгляд наиболее разумно предположить, что такими проводящими объектами являются дислокации, лежащие вдоль [110], например, 90° частичные.

Следует отметить, что в ${}^4\text{Ge}$ при исследовании ЭПР с дислокациями обнаружен ряд линий, возникающих после освещения образца, фаза которых противоположна обычным ЭПР линиям. В принципе сигнал ЭПР противоположной фазы может быть получен при на-

рушении условий медленного прохождения⁵. Однако, наиболее вероятно, что в⁴ наблюдается аналогичный эффект.

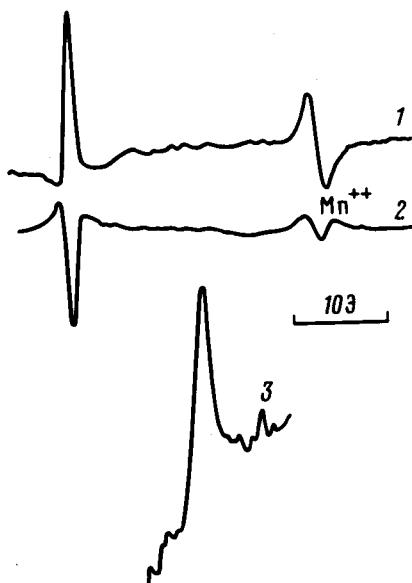


Рис. 1

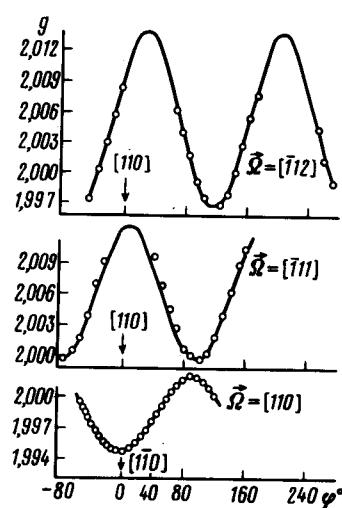


Рис. 2

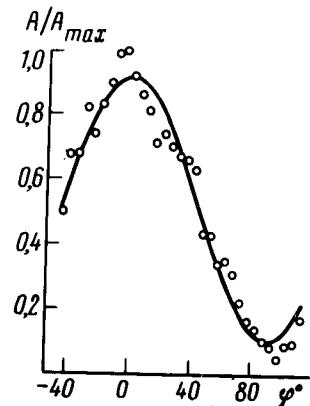


Рис. 3

Регистрируемые производные поглощения и дисперсии соответствуют $\partial\epsilon''/\partial H$ и $\partial\epsilon'/\partial H$, где $\epsilon = \epsilon' + i\epsilon''$ — диэлектрическая проницаемость образца. Как следует из рис. 3, $\frac{\partial\chi'/\partial H}{\partial\epsilon'/\partial H} < 0,1$. То же самое можно сказать и о $\frac{\partial\chi''/\partial H}{\partial\epsilon''/\partial H}$, где $\chi = \chi' + i\chi''$ — магнитная восприимчивость образца, резонансно меняющаяся в обычном ЭПР. Оценка числа парамагнитных центров, исходя из этого факта и величины сигнала, дает $N_{Ch} < 10^{13} \text{ см}^{-3}$.

По предварительным измерениям, величина сигнала $\partial\epsilon''/\partial H$ и $\partial\epsilon'/\partial H$ растет с уменьшением мощности вплоть до $P_{СВЧ} \simeq 10^{-7} \text{ Вт}$ ($H_{СВЧ} \simeq 10^{-3} \text{ Э}$).

Анализ формы линии показывает, что знак $\partial\epsilon'/\partial H$ и $\partial\epsilon''/\partial H$ совпадает. Если проводящие участки дислокаций представить в виде очень вытянутых эллипсоидов длиной l , радиусом r и проводимостью на единицу длины S , то согласно⁶ такое синхронное изменение ϵ' и ϵ'' при изменении величины S возможно лишь в случае $2\pi\epsilon_0\epsilon_b f_0 l^2 > \kappa S$, где $\epsilon_0\epsilon_b$ — диэлектрическая проницаемость кремния, $\kappa = 6/\pi[\ln(l/r) - 1]$. Таким образом проводящие участки должны быть достаточно длинными. К такому же выводу можно прийти из соображений о необходимости наличия на длине l хотя бы одного Cu -центра.

Литература

1. Grazhulis V.A., Kveder V.V., Osipyan Yu. A. Phys. stat. sol. (b), 1982, 103, 519.
2. Золотухин М.Н., Кведер В.В., Осипьян Ю.А. ЖЭТФ, 1981, 81, 299.
3. Гражулис В.А., Кведер В.В., Мухина В.Ю., Осипьян Ю.А. Письма в ЖЭТФ, 1976, 24, 164.
4. Pakulis E.J. J. Magn. Res., 1983, 51, 490.
5. Weger W. Bell. Syst. Techn. J., 1960, 39, 1013.
6. Labusch R. Physica, 1983, 117B, 203. North-Holland Publ. Comp.